

1 Transistore MOS

1.1 Condensatore MOS

Condensatore con: Metallo (elettrodo indicato con G, gate), Ossido (SiO₂, che fa da dielettrico), Silicio (elettrodo indicato con B, bulk o body o substrato); da cui MOS.

1.2 Potenziale di banda piatta

Cortocircuitiamo i terminali del condensatore, connettendo G e B. Allora dal lato del Met-Ox si accumuleranno cariche positive, mentre dal lato Ox-Si cariche negative. La tensione da applicare per annullare la carica sull'interfaccia è detta tensione di banda piatta (flat band):

$$V_{FB} = -\Phi_G - V_T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}}, \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

dove Φ_G dipende dal Metallo (potenziale intrinseco del metallo), t_{ox} è lo spessore dell'ossido, $\epsilon_{ox} = 1/3\epsilon_{si}$ la costante dielettrica, C_{ox} la capacità dell'ossido, Q_{ox} la carica accumulata all'interfaccia dell'Ox.

1.3 Effetto della tensione V_{GB} nel condensatore MOS

L'applicazione di una V_{GB} diversa da V_{FB} genera un accumulo di cariche nelle regioni ai lati dell'Ox, su cui si sviluppa una carica Q_{ox} e una tensione V_{ox} , per la quale vale che

$$V_{ox} \neq V_{GB} \text{ in generale} \quad V_{ox} = 0 \iff V_{GB} = V_{FB} \quad V_{GB} \uparrow \implies V_{ox} \uparrow$$

Detta Q_G (g da Gate) la carica indotta nel Met e Q_B (b da Bulk) la carica indotta nel Silicio si ha

$$Q_G = -Q_B = C_{ox} V_{ox} \implies Q_G > 0, Q_B < 0$$

Il potenziale φ_S è detto potenziale di superficie e rappresenta il valore del potenziale alla superficie del semiconduttore, cioè $\varphi_S = V(0) = V_{si}$ anche. Si arriva quindi alla legge fondamentale

$$V_{GB} - V_{FB} = \varphi_S + V_{ox} \implies V_{GB} - V_{FB} = \varphi_S + \frac{Q_G}{C_{ox}} = \varphi_S + \frac{-Q_B}{C_{ox}}$$

Al variare di V_{GB} ci sono varie regioni di funzionamento.

1.4 Regione in accumulazione

Si ha quando $V_{GB} < V_{FB} \iff V_{GB} \ll V_{TH0} \iff \varphi_S < 0$ (che approssimeremo con $\varphi_S = 0$). In questo contesto

$$\varphi_S = V(0) = V_{si} = 0 \implies V_{GB} - V_{FB} = \frac{Q_G}{C_{ox}} = \frac{-Q_B}{C_{ox}}$$

e Q_G e Q_B sono delta di Dirac concentrate in N_A e $-N_A$. Se servisse $p(0)$ vale la legge di azione di massa

$$p(0) = \frac{n_i^2}{n(0)} = N_A e^{-\varphi_S/V_T}$$

1.5 Regione in svuotamento (depletion)

Si ha quando $V_{GB} > V_{FB}$ (ma solo superiore di poco) $\iff 0 < \varphi_S < \varphi_F \iff V_{GB} < V_{TH0}$. All'aumentare della tensione V_{GB} le lacune vengono progressivamente respinte dalla superficie e lasciano una regione svuotata, ma comunque $p(0) > n(0)$. Definiamo quindi Q_d (d da dep) la carica di svuotamento

$$Q_d = Q_{dep} = -qN_A x_{dep} \quad Q_d = Q_B = -Q_G$$

ma in questa regione Q_c è circa zero, quindi $Q_B = Q_d$. E ora ricaviamo le relazioni per campo elettrico e potenziale

$$E(x) = \frac{-qN_A}{\epsilon_{si}}(x - x_{dep}) \quad V(x) = \frac{qN_A}{\epsilon_{si}}(x - x_{dep})^2$$

l'ampiezza della regione svuotata, x_{dep} (da cui Q_d)

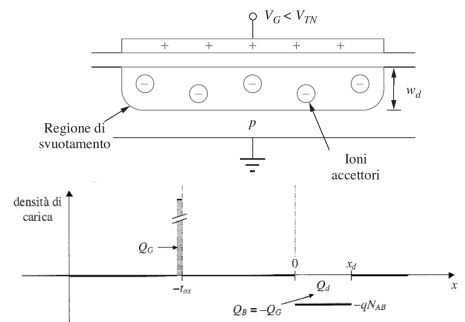
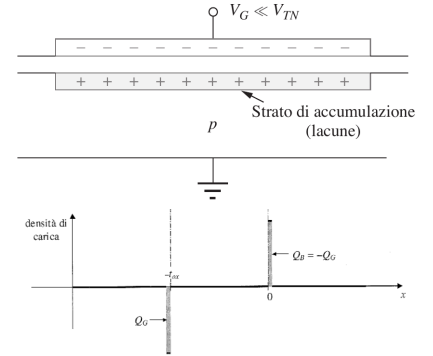
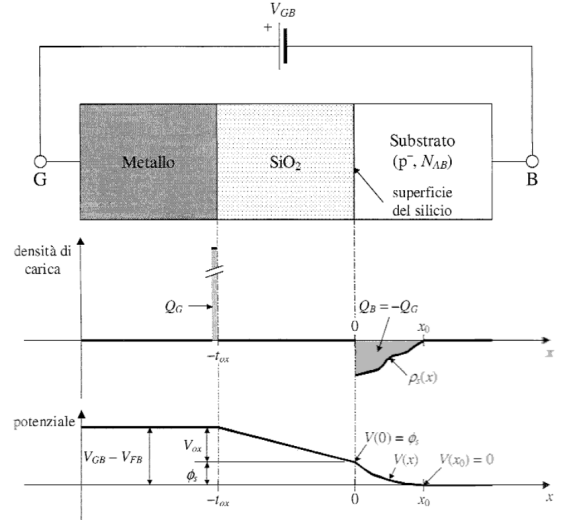
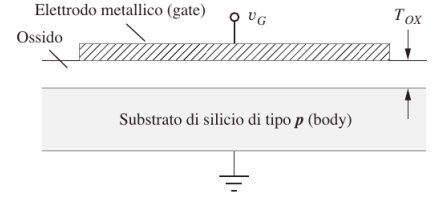
$$x_{dep} = \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{q} \frac{1}{N_A} \varphi_S} \implies Q_d = -qN_A x_{dep} = -\sqrt{2q\epsilon_{si} N_A \varphi_S}$$

Si può poi sostituire Q_d nella relazione fondamentale ($V_{GB} - V_{FB} = ecc$) e si ricava un'eqz da cui trovare φ_S . Sennò comunque è collegata a x_{dep} , per cui se si conosce uno o l'altro si può passare da

$$\varphi_S = V(0) = \frac{qN_A}{2\epsilon_{si}} x_{dep}^2$$

1.6 Regione in inversione

Si ha quando si aumenta ancora V_{GB} , cioè $V_{GB} \gg V_{FB} \iff V_{GB} > V_{TH0}$. Ora oltre alla repulsione di lacune si osserva un avvicinamento di elettroni, che contribuiscono a Q_B sommandosi a Q_d , e ora $p(0) < n(0)$. La loro carica la chiameremo Q_c (c da



canale), quindi

$$Q_B = Q_d + Q_c \quad Q_c \propto n(0) = n(x_{\text{dep}})e^{\varphi_S/V_T} = \frac{n_i^2}{N_A}e^{\varphi_S/V_T}$$

Il contributo di Q_c su Q_B dipende da φ_S . Definendo

$$\varphi_F = V_T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

si nota che

$$\varphi_S = \varphi_F \iff n(0) = n_i \quad \varphi_S = 2\varphi_F \iff n(0) = N_A$$

da cui si specificano le regioni di funzionamento (“trascurabile” è inteso come contributo nel calcolo di Q_B):

- $\varphi_S < 0 \rightsquigarrow$ accumulazione
- $0 < \varphi_S < \varphi_F \rightsquigarrow$ svuotamento
- $\varphi_F < \varphi_S < 2\varphi_F \rightsquigarrow$ debole inversione: $Q_c = 0$ trascurabile, $\implies Q_B = Q_d$
- $\varphi_S > 2\varphi_F \rightsquigarrow$ forte inversione: $Q_c > 0$ non più trascurabile, $\implies Q_B = Q_d + Q_c$

Con “soglia” si intende quando $\varphi_S = 2\varphi_F + V_c$, e V_c è sempre da contare quando le regioni sono polarizzate (cioè quando $V_S = V_D \neq 0$, sono loro $= V_c$).

1.6.1 Regione di forte inversione

Siamo nel caso $\varphi_S > 2\varphi_F$. Ora φ_S si può comunque sempre approssimare a $\varphi_S = 2\varphi_F$, quindi Q_d resta di fatto costante mentre Q_B aumenta ma quindi per il solo effetto di Q_c . La x_{dep} e Q_d si estendono fino a valori massimi

$$x_{\text{dep}}^{\text{max}} = \sqrt{\frac{4\varepsilon_{\text{si}}\varphi_F}{qN_A}} \quad Q_d^{\text{max}} = -\sqrt{4q\varepsilon_{\text{si}}N_A\varphi_F}$$

La relazione fondamentale si riscrive quindi in (perché $Q_B = Q_d + Q_c$)

$$V_{\text{GB}} - V_{\text{FB}} = \varphi_S - \frac{Q_B}{C_{\text{ox}}} = \varphi_S - \frac{Q_d + Q_c}{C_{\text{ox}}} = \varphi_S + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{\text{si}}N_A\varphi_S}}{C_{\text{ox}}} - \frac{Q_c}{C_{\text{ox}}}$$

questa formula generale si riduce a seconda dei due casi:

$$\text{debole inv. } (Q_B = Q_d): V_{\text{GB}} - V_{\text{FB}} = \varphi_S - \frac{Q_d}{C_{\text{ox}}} = \varphi_S + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{\text{si}}N_A\varphi_S}}{C_{\text{ox}}}$$

$$\text{forte inv. } (Q_B = Q_d^{\text{max}} + Q_c): V_{\text{GB}} - V_{\text{FB}} = 2\varphi_F - \frac{Q_d^{\text{max}} + Q_c}{C_{\text{ox}}} = 2\varphi_F + \frac{\sqrt{4q\varepsilon_{\text{si}}N_A\varphi_F}}{C_{\text{ox}}} - \frac{Q_c}{C_{\text{ox}}}$$

Dunque considereremo la carica Q_c presente solo in regione di forte inversione, e in tal caso si sviluppa quindi un canale di elettroni.

1.7 Tensione di soglia

Definiamo tensione di soglia V_{TH0} la tensione da applicare in un condensatore MOS affinché si formi il canale \iff la V_{GB} minima per generare Q_c non trascurabile $\iff V_{\text{GB}}$ per arrivare in forte inversione. Definendo γ coefficiente di body si riscrive la relazione fondamentale in (da cui V_{TH0} e la carica di canale)

$$\gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{\text{si}}N_A}}{C_{\text{ox}}} \implies V_{\text{GB}} - V_{\text{FB}} = 2\varphi_F + \gamma\sqrt{2\varphi_F} - \frac{Q_c}{C_{\text{ox}}} \rightsquigarrow V_{\text{TH0}} = V_{\text{FB}} + 2\varphi_F + \gamma\sqrt{2\varphi_F} \quad -Q_c = C_{\text{ox}}(V_{\text{GB}} - V_{\text{TH0}})$$

1.8 Il transistor MOS

Dispositivo con quattro terminali: Gate, Source, Drain, Bulk (con Si^p se NMOS), ma di fatto ne ha tre perché B sarà sempre a terra: $V_B = 0$ (in modo da avere diodi antiparalleli tra il Si e le regioni diffuse), e indichiamo V_G, V_S, V_D le altre tensioni (o le equivalenti $V_{\text{GB}}, V_{\text{SB}}, V_{\text{DB}}$ ricordando $V_{XY} = V_X - V_Y$ e che tanto $V_B = 0$).

- Se $V_G < V_{\text{TH0}}$ non scorre corrente in nessun terminale
- Se $V_G > V_{\text{TH0}}$ (quindi si va nella regione di inversione) si crea il canale di elettroni tra S e D, e applicando una $V_{\text{DS}} = |V_{S=0}V_D| > 0$ si riesce a far scorrere corrente. Nel caso di forte inversione (V_c è la tensione nel canale, sarebbe $V_c(y)$)

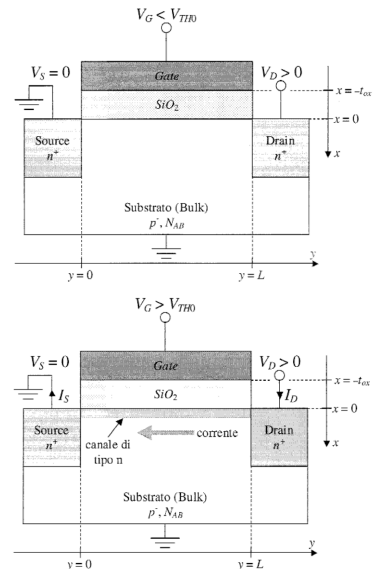
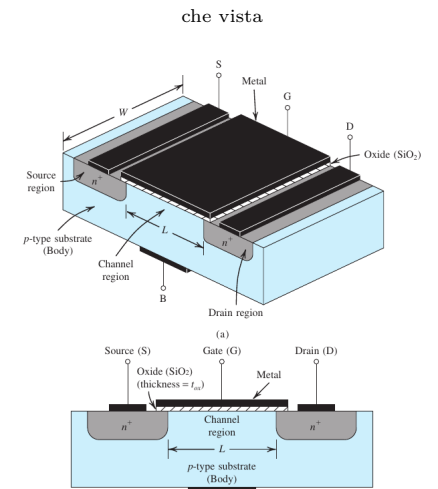
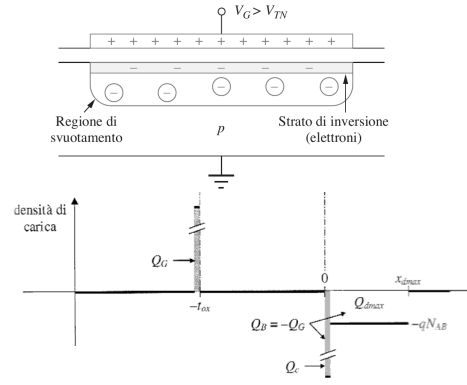
$$\varphi_S = 2\varphi_F + V_c \implies x_{\text{dep}}^{\text{max}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\text{si}}(2\varphi_F + V_c)}{qN_A}} \quad Q_d^{\text{max}} = -\sqrt{2q\varepsilon_{\text{si}}N_A(2\varphi_F + V_c)}$$

$$V_c = V_c(y) = \begin{cases} V_c(0) = V_S \\ V_c(L) = V_D \end{cases} \quad V_{\text{GB}} - V_{\text{FB}} = (2\varphi_F + V_c) + \gamma\sqrt{2\varphi_F + V_c} - \frac{Q_c}{C_{\text{ox}}}$$

(possibile approx: $V_c = V_S = V_{\text{SB}}$) La V_c modifica anche l'identificazione delle regioni di funzionamento: al posto di φ_S si dovranno valutare le disuguaglianze con $\varphi_S - V_c$. E allo stesso modo le altre relazioni (come quelle per n_0 e p_0). Comunque, definiamo ora V_{TH} la tensione di soglia del transistor MOS

$$V_{\text{TH}} = V_{\text{FB}} + 2\varphi_F + \gamma\sqrt{2\varphi_F + V_{\text{SB}}} = V_{\text{TH0}} + \gamma\left(\sqrt{2\varphi_F + V_{\text{SB}}} - \sqrt{2\varphi_F}\right) \\ \implies Q_c(y) = -C_{\text{ox}}(V_G - V_{\text{TH}} - V_c(y)) \quad (\text{se } V_G - V_{\text{TH}} - V_c > 0; 0 \text{ altrimenti})$$

1.8.1 Relazioni Corrente - Tensione: $I_D = I_D(V_{\text{DS}})$



Regioni di funzionamento del dispositivo:

- Interdizione $\iff V_{GS} < V_{TH} (\implies V_{GD} < V_{TH})$
Qui $I_D = 0, Q_c(y) = 0 \forall y$
- Triodo $\iff V_{GS} > V_{TH}, V_{GD} > V_{TH} (V_{GD} = V_{GS} - V_{DS})$
Qui $I_D \neq 0, Q_c(y) \neq 0 \forall y$ e il canale esiste e ha lunghezza L
- Saturazione $\iff V_{GS} > V_{TH}, V_{GD} < V_{TH}$.
Qui $I_D \neq 0, Q_c(0) \neq 0, Q_c(L) = 0$ e il canale esiste ma ha lunghezza L'

Dai calcoli si ricava

- Per piccole V_{DS} il comportamento è da resistore

$$-Q_{tot} = -Q_c W L, \quad I_D = \frac{-Q_{tot}}{\tau_{tr}} = \frac{W L (V_{GS} - V_{TH}) C_{ox}}{\tau_{tr}}, \quad \tau_{tr} = \frac{L^2}{\mu_n V_{DS}}$$

$$\implies I_D(V_{DS}) = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} = \frac{1}{R_{MOS}} V_{DS}$$

- All'aumentare di V_{DS} si ha un andamento a parabola, e l'andamento vero è dato da

$$I_D(V_{DS}) = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

parabola con vertice in V_{DS}^{sat}, I_D^{sat} :

$$V_{DS}^{sat} = V_{GS} - V_{TH} \quad I_D^{sat} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \underbrace{(V_{GS} - V_{TH})^2}_{V_{DS}^{sat}}$$

al punto di saturazione V_{DS} è tale che rende $Q_c(L) = 0$, perché $V_{DS} \uparrow \implies$ il canale si fa più pendente. Lo strozzamento del canale in cui la carica si annulla è detto pinch-off. Se $V_{DS} \uparrow$ oltre $V_{DS}^{sat} \implies L \searrow L'$

- In realtà in saturazione la pendenza aumenta un po' comunque.

Definendo λ coefficiente di modulazione della lunghezza di canale si ha la correzione

$$I_D(V_{DS}) = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 [1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS}^{sat})] \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad \lambda = -\frac{1}{L} \frac{d}{dV_{DS}}$$

1.8.2 Relazioni Corrente - Tensione: $I_D = I_D(V_{GS})$

$$I_D(V_{GS}) = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L'} (V_{GS} - V_{TH})^2, \quad L' = L'(V_{DS})$$

1.9 Effetti capacitivi

Detta C_{GC} la capacità tra gate e canale si ha

$$C_{GC} \Big|_{\text{triode}} = C_{ox} W L, \quad C_{GC} \Big|_{\text{sat}} = \frac{2}{3} C_{ox} W L \rightsquigarrow I_D = -\frac{\bar{Q}_C}{\tau_{tr}} = \frac{\frac{2}{3} C_{ox} W L (V_{GS} - V_{TH})^2}{\frac{4}{3} \frac{L^2}{\mu_n (V_{GS} - V_{TH})}}$$

In regime di svuotamento invece si parla di C_{GB} , capacità tra gate e bulk

$$C_{GB} = \frac{C_{ox} C_{dep}}{C_{ox} + C_{dep}}, \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad C_{dep} = \frac{\epsilon_{si}}{x_{dep}}$$

2 Analisi Circuitale dei Transistori

Ricordando la convenzione: V_{XY} è la tensione che va da Y a X e $V_{XY} = V_X - V_Y$.

Quindi per esempio V_{GS} va da S a G. Condizioni dei transistori:

Transistore NMOS. Acceso: $V_{GS} > V_{TH} > 0$, in sat: $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH} \iff V_{GD} < V_{TH}$
Per riconoscerlo, deve avere la corrente che scorre entrante verso S, e S deve essere più in basso di D (perché $V_D > V_S$ nell'NMOS).

Transistore PMOS. Acceso: $V_{GS} < V_{TH} < 0$, in sat: $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH} \iff V_{GD} > V_{TH}$
Per riconoscerlo, deve avere la corrente che scorre uscente da S, e S deve essere più in alto di D (perché $V_S > V_D$ nel PMOS).

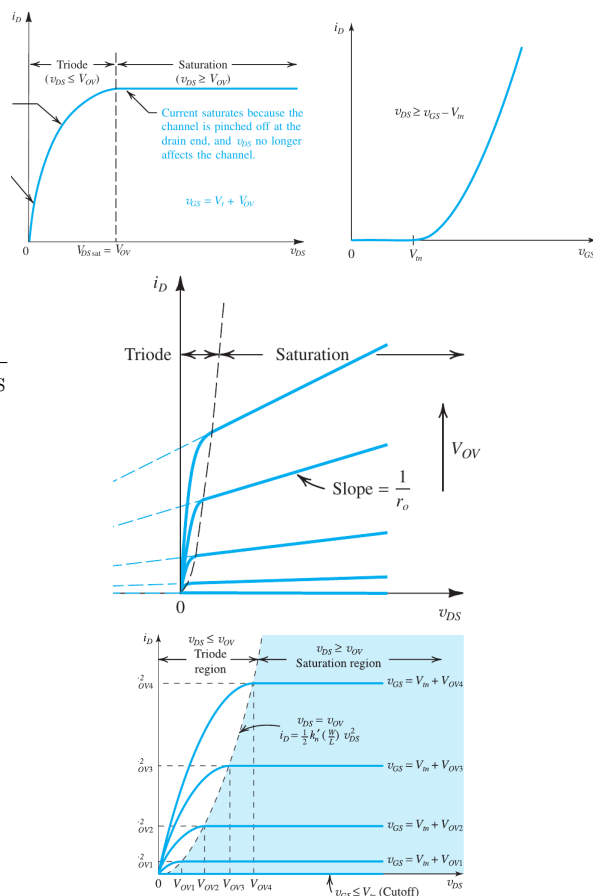
2.1 Risoluzione circuiti

Scrittura variabili: "totale = polarizzazione + piccolo segnale" $\iff v_{DS} = V_{DS} + v_{ds}$

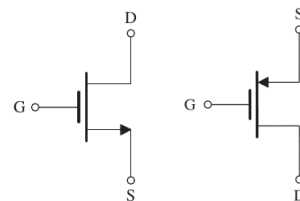
Polarizzazione. In questa fase indichiamo le variabili come $V_{DS}, V_{GS}, I_D, \dots$ E si risolve un circuito con

- solo i grandi generatori accesi (quelli di piccolo segnali spenti) perché si vuole trovare il pto di lavoro
- condensatori spenti (diventano ca) perché lavoriamo a frequenza $f = 0$
- MOS così come sono, non si modificano

Si inizia supponendo i MOS siano in saturazione, e si ricava V_{GS} o I_D in qualche modo: trovando un'eqz (tipo una KVL) che lo contenga; dalla corrente nel MOS scritta in sua funzione, $I_D^{sat} = \frac{1}{2} \mu_n |p| C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$; da partitori; ecc. E nel caso di eqz quadratica si sceglie il valore che rispetta le condizioni sopra (sul MOS acceso). Poi nota una o l'altra calcoliamo le altre tensioni/varibili utili a verificare la validità dell'ipotesi di saturazione. E se l'hp è soddisfatta si prosegue oltre; se non lo è: si scrive un'altra eqz che lega V_{GS} alla corrente ma la si risolve scrivendo tale corrente nella sua forma completa, quella nella regione di



Un NMOS e un PMOS.



triolo, $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$. Una volta finito si calcolano i parametri di piccolo segnale:

$$g_n = \left| \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} \right| \quad r_0 = \left| \frac{1}{\lambda I_D} \right| \quad g_{nb} = \frac{g_n \gamma / 2}{\sqrt{2\varphi_F + V_{SB}}}$$

Cioè la conduttanza g_n , che può variare per i vari transistori (e avremo g_{n1} , g_{n2} , ecc); la resistenza r_0 se il testo dà λ nei dati, sennò la si trascura; e infine se servisse anche la conduttanza g_{nb} .

Piccolo segnale. In questa fase indichiamo le variabili come v_{ds} , v_{gs} , i_d , ... L'obiettivo qui è trovare la fdt v_{out}/v_{in} . E si risolve un circuito con

- solo i generatori di segnale accesi, tutti gli altri grandi (compresi quelli delle linee di alimentazione) spenti
- condensatori presenti
- MOS (N e P) convertiti ai loro modelli equivalenti. Se il MOS era un trans-diodo (cioè con G in cc con D) il suo modello equivalente è solo una resistenza da $1/g_n$ tra S e D (e si mantiene il cc tra D e G), ed è sempre in saturazione

Nel caso di stadio differenziale (configurazione a specchio, un NMOS e un PMOS con S in comune) l'analisi di piccolo segnale si divide in altre due sotto fasi. Da v_{in1} e v_{in2} definiamo

$$v_{cm} = \frac{v_{in1} + v_{in2}}{2}, \quad v_d = v_{in1} - v_{in2} \rightsquigarrow \begin{cases} v_{in1} = v_{cm} + v_d/2 \\ v_{in2} = v_{cm} - v_d/2 \end{cases}$$

e risolviamo quindi il circuito in questi due casi:

- (1) $v_{in1} = v_d/2 = -v_{in2} \quad i = \frac{g_n}{2} v_d$
- (2) $v_{in1} = v_{in2} = v_{cm} \quad i = \frac{1}{1/g_n + 2R_{tail}} v_{cm}$

2.1.1 Funzioni di trasferimento celebri

S a massa, $\frac{v_d}{v_g} = -g_n Z_d$ S non a massa, $\frac{v_d}{v_g} = -\frac{Z_d}{1/g_n + Z_s}$

2.2 Funzioni di trasferimento

Forma standard funzione di trasferimento: $G(s) = \frac{\mu}{s^h} \frac{\prod_j (1 + s\tau_j)}{\prod_j (1 + sT_j)}$
 Frequenze: $\frac{1}{2\pi K_j}$

$-1/\tau_j$ zeri (simbolo o) $\rightarrow +20$ dB

$-1/T_j$ poli (simbolo x) $\rightarrow -20$ dB

Si parte con pendenza: $-20 \cdot \#(\text{poli in } 0)$ se ne \exists , $+20 \cdot \#(\text{zeri in } 0)$ se ne \exists , 0 altrimenti.

Il guadagno μ lo si calcola vedendo a cosa è asintotica la fdt per $s \rightarrow +\infty$, se siamo oltre tutti gli zeri e poli. Altrimenti lo calcoliamo così:

- tenendo sempre tutte le costanti
- trattando $1 + sK_j \xrightarrow{s \rightarrow 0} 1$ se μ è prima del polo/zero (è come se fossimo con $s \approx 0$ per lui)
- trattando $1 + sK_j \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} sK_j$ se μ è dopo al polo/zero (è come se fossimo con s altissime per lui)

Risposta allo scalino:

- valore asintotico: $\bar{y} = G(0) \cdot A$ (con A l'ampiezza dello scalino)
- valore iniziale: la prima derivata non nulla è la r -esima, dove $r = \#(\text{poli}) - \#(\text{zeri})$. Quindi $y^{(k)}(0) = 0 \forall 0 \leq k < r \quad y^{(r)}(0) = s^r G(s) \Big|_{s \rightarrow +\infty}$
- N numero di estremi è tale che $m_s \leq N \leq m_s + \delta$, dove $m_s = \#(\text{zeri superiori})$, $\delta = \#(\text{zeri male inquadriati})$

Check per i calcoli: deve valere che

$$\# \text{condensatori} = \# \text{poli} \quad |\text{poli}| = C \cdot R_{eq} \text{ vista dal condensatore}$$

Per calcolare le fdt in sicurezza è comodo scomporle tra più parti, ad esempio con

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_{g1}}{v_{in}} \frac{v_{d1}}{v_{g1}} \frac{v_{s1}}{v_{d1}} \frac{v_{out}}{v_{s1}}$$

e poi ricordare i partitori.

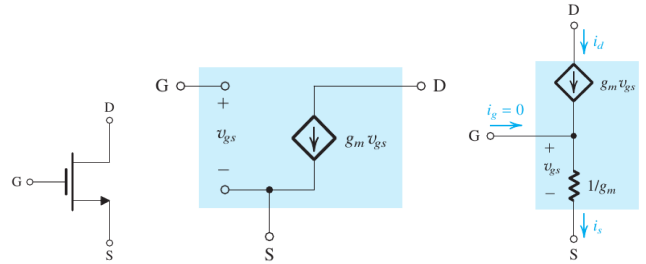
Partitore di tensione: nota V sulla serie di resistenze (e impedenze Z), vale che

$$V_x = V \frac{R_x}{R_{eq}} = V \frac{R_x}{\sum_i R_i} \quad \left(R_1 || R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

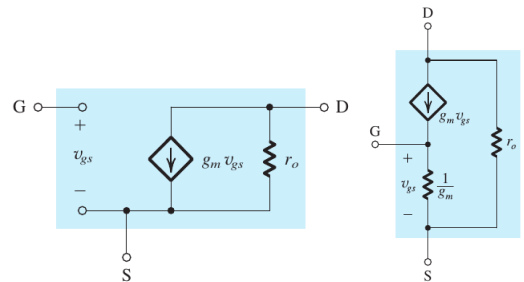
Ricordando che i condensatori C hanno impedenza $Z_C = \frac{1}{sC}$ o ammettenza $Y_C = sC$. Se poi ho delle resistenze in serie che voglio convertire in conduttanze, prima le sommo per trovare la resistenza equivalente, e poi prendo $1/\text{quello}$. Per esempio, serie di C e R : $R_{eq} = R + \frac{1}{sC} \implies G_{eq} = \frac{1}{sC + R}$

Comunque i condensatori sono ca a basse frequenze, normale alle medie (e li tratto con le impedenze), cc alle alte.

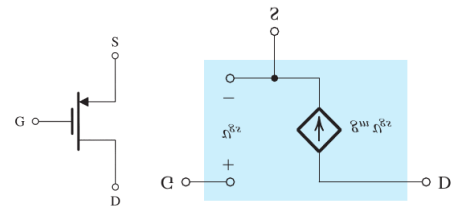
Modello piccolo segnale *senza* r_0 ; con la seconda struttura che esplicita la resistenza $1/g_n$. Vale per un NMOS, per un PMOS va specchiata: avremo un generatore che fa scorrere la corrente da D a S ma quindi verso l'alto (perché ora S è sopra a D), per il resto non cambia nulla.



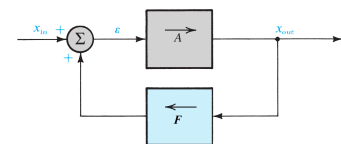
Modello piccolo segnale *con* r_0 ; con la seconda struttura che esplicita la resistenza $1/g_n$. E r_0 va contato solo se il testo dà λ . Vale come sopra per i PMOS.



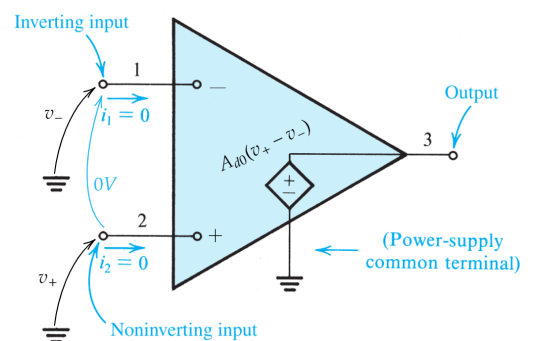
Artigianata per mostrare che succede col PMOS.



A: blocco di andata, F: blocco di feedback.



Amplificatore. Il "naso del topo" è dove c'è il terminale 3.



Partitore di corrente: nota I sul parallelo di conduttanze (e ammettenze Y), vale che

$$I_x = I \frac{G_x}{G_{eq}} = I \frac{G_x}{\sum_i G_i}$$

3 Amplificatori Operazionali: OPAMP

Di un circuito le fdt A ed F in generale non sono visibili, ma le possiamo ricavare trovando due quantità più comode e sfruttando poi il loro legame con le prime:

$$\mathcal{G}_{id} = -\frac{1}{F}, \quad \mathcal{G}_{loop} = AF \quad \left(\rightsquigarrow \mathcal{G}_{reale} = \frac{\mathcal{G}_{id}}{1 - 1/\mathcal{G}_{loop}} = \frac{A}{1 - \mathcal{G}_{loop}}, \quad A = A(s) = -\mathcal{G}_{loop}\mathcal{G}_{id} \text{ guadagno d'andata} \right)$$

Per trovarle servono due passaggi (due sottocircuiti da risolvere):

- \mathcal{G}_{id} . Risolvo un circuito ponendo $v_+ = v_-$ “per la retroazione” e ricavo la fdt. Infine avremo che $v_{out} = (\mathcal{G}_{id})v_{in}$
- \mathcal{G}_{loop} . Risolvo un circuito ausiliario, dove
 - spengo gli ingressi, $v_{in} = 0$
 - apro l’anello dopo il “naso del topo”, e lì dove ho aperto ci metto un segnale v_{test} ; che sia su un terminale che entri verso il $(-)$, con la freccia orientata dalla massa verso l’AMP

Per risolverlo devo trovare v_+ e v_- . Nel loro calcolo *non* posso usare il fatto che ci sono 0V tra i terminali \pm dell’AMP, mentre vale ancora che tra i suoi terminali scorrono 0A. Comunque da loro trovo v_{out} , che in genere dovrebbe essere $A_{d0}(v_+ - v_-)$, e infine avremo che $v_{out} = (\mathcal{G}_{loop})v_{test}$

Nel caso ci siano condensatori considereremo il guadagno dell’operazionale non più con la sola funzione A_{d0} ma ora con $A_d(s) = \frac{A_{d0}}{1 + \tau_d s}$ il cui polo è *sempre* il polo da mettere per primo; è quello con frequenza più bassa.

Grafico riassuntivo:

- Calcolo \mathcal{G}_{id} e \mathcal{G}_{loop} , da cui trovo $A(s)$; 2. Plotto insieme $A(s)$ e \mathcal{G}_{id}
- La distanza tra (le pendenze de) i due grafici (fatta proprio puntualmente o su intervalli) mi dà l’andamento di \mathcal{G}_{loop}
- Il grafico di \mathcal{G}_{reale} lo ricavo dal minimo tra i due grafici su ogni intervallo

3.1 Configurazioni famose

Ce ne sarebbero altre ma si possono tutte ricavare col metodo descritto sopra. Comunque:

- Configurazione non invertente

$$\mathcal{G}_{id} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \quad \mathcal{G}_{loop} = -A_{d0} \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

- Configurazione invertente

$$\mathcal{G}_{id} = -\frac{Z_2}{Z_1} \quad \mathcal{G}_{loop} = -A_{d0} \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

- Se ho due ingressi, v_{in1} e v_{in2} conviene usare il PSE

3.2 Stabilità

Si ha stabilità $\iff \varphi_m > 0$, dove calcoliamo φ_m nella f_{0dB} , cioè nella frequenza in cui il grafico della \mathcal{G}_{loop} interseca l’asse a 0dB. In quel punto il guadagno è 1.

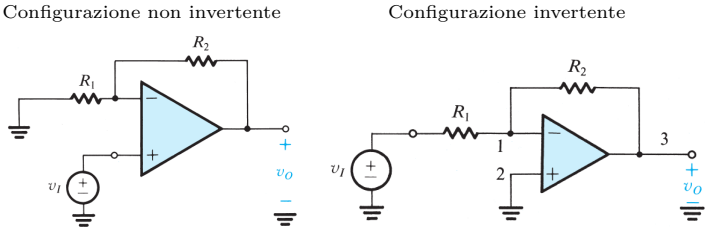
$$\varphi_m = 2\pi + \sum \angle \mathcal{G}_{loop}(s)|_{s=f_{0dB}} = 2\pi + \sum \angle (\text{poli, zeri})|_{s=f_{0dB}} \quad \angle(1 + sK) = \arctan(sK/1) \approx \pm \pi/2 \text{ qc}$$

Per trovare tale frequenza si usa la conservazione guadagno-frequenza: vale sempre che

$$|g| \cdot \left(\frac{1}{2\pi\omega} \right)^n = \text{costante} \quad n = [\#(\text{poli}) - \#(\text{zeri})] \text{ strettamente alla sinistra dell’}\omega \text{ più a destra}$$

Il testo spesso darà come dato un certo GBWP; quella è proprio la costante del prodotto guadagno-frequenza. Utilizzo:

$$\text{GBWP} = \frac{A_{d0}}{2\pi\tau_d} \quad |g_1| \cdot \left(\frac{1}{2\pi\omega_1} \right)^n = |g_2| \cdot \left(\frac{1}{2\pi\omega_2} \right)^n \quad n \text{ deve essere uguale} \quad g|_{\text{in dB}} = 10^{g/20}|_{\text{in lineare}} \quad (\text{conversione})$$



4 Strumentopoli misteriosi

Eqz sulle variabili del Capitolo Semiconduttori

$$v_{th} = \frac{q\tau_c}{m_{eff}} E \quad I = AJ \quad D = v_d^2 \tau_c = v_{th} l \quad L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad v_n^{diff} = \frac{D_n}{L_n} \quad v_p^{diff} = \frac{D_p}{L_p}$$
$$qE = m_{eff} a \quad I = GV \quad V = RI \quad \left(G = \sigma \frac{A}{L} \quad R = \rho \frac{L}{A} \right) \quad V(x) = - \int E(x) dx \quad E(x) = \int \frac{1}{\epsilon} \rho(x) dx$$

Prefissi del 10 ⁻			Costanti fisiche		Unità di misura	
Fattore	Nome	Prefisso	Variabile, Valore	Udm	Variabile	Udm
10 ¹²	tera	T	$\epsilon_{si} = 1 \cdot 10^{-12}$	F/cm	C_{ox}	F/cm ²
10 ⁹	giga	G	$\epsilon_{ox} = 1/3 \epsilon_{si}$		ρ	Ωcm
10 ⁶	mega	M	$q = 1.6 \cdot 10^{-19}$	C	μ	cm ² /(Vs)
10 ³	kilo	k	$n_i = 9.65 \cdot 10^9$	cm ⁻³		
10 ²	etto	h	$V_T = 26 \cdot 10^{-3}$	V		
10 ¹	deca	da	$\mu_{n,si} = 1350$	cm ² /Vs		
10 ⁻¹	deci	d	$\mu_{p,si} = 480$	cm ² /Vs		
10 ⁻²	centi	c	$k = 1.38 \cdot 10^{-23}$	m ² kg s ⁻² K ⁻¹		
10 ⁻³	milli	m	1 $\mu\text{m} = 1 \cdot 10^{-4}$ cm			
10 ⁻⁶	micro	μ				
10 ⁻⁹	nano	n				
10 ⁻¹²	pico	p				
10 ⁻¹⁵	femto	f				
10 ⁻¹⁸	atto	a				

5 Diodi e giunzione pn

La giunzione pn si ottiene accostando due silici, uno drogato p e l'altro drogato n.

1. Data la differenza di concentrazioni tra lacune e elettroni nasce una corrente di diffusione da p verso n
2. I portatori diffusi si ricombinano in fretta lasciando una zona in cui ci sono solo le cariche dei droganti (hp di svuotamento completo): la zona di carica spaziale (ZCS), dove nasce quindi un campo elettrico da n verso p
3. Il campo elettrico genera quindi una corrente di deriva, da n verso p.

5.1 Giunzione all'equilibrio, $V_{est} = 0$

Qui le correnti si eguagliano, $J_{diff} = J_{drift}$. La barriera di potenziale è data dalla V_{bi} , V built in, data da

$$V_{bi} = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Dalla neutralità delle cariche segue che (A è la superficie della giunzione)

$$Q_+ = qAx_n N_D = |Q_-| = qAx_p N_A \implies N_D x_n = N_A x_p$$

$$Q_+ = |Q_-| = Q_J = Aq \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} x_{dep} \right)$$

La ZCS insiste sulla regione meno drogata. La sua estensione è

$$x_{dep} = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_{bi}}$$

$$\implies x_n = x_{dep} \frac{N_A}{N_A + N_D} \quad x_p = x_{dep} \frac{N_D}{N_A + N_D}$$

La pendenza del campo elettrico nei due tratti è

$$\frac{-qN_A}{\epsilon_{si}} \quad \frac{+qN_D}{\epsilon_{si}}$$

E il suo massimo è in 0, dato da

$$E_{max} = \frac{qN_D}{\epsilon} x_n = \frac{-qN_A}{\epsilon} x_p$$

Vale inoltre che (detta $\mathcal{A}_{\Delta E}$ l'area sottesa dal campo elettrico)

$$\mathcal{A}_{\Delta E} = \frac{1}{2} x_{dep} |E_{max}| = V_{bi} - V_{est}$$

5.2 Giunzione fuori equilibrio, $V_{est} \neq 0$

Convenzione: $V_{est} : n \rightarrow p$. A seconda del segno di V_{est} si alza o si abbassa la barriera di potenziale.

Polarizzazione inversa quando $V_{est} < 0$, sale la barriera di potenziale. La ZCS si allarga, $x_{dep} \uparrow$. Le formule si aggiornano con $V_{bi} \mapsto V_{bi} + V_{est}$, e $J_{diff} \downarrow$.

Polarizzazione diretta quando $V_{est} > 0$, scende la barriera di potenziale. La ZCS si stringe, $x_{dep} \downarrow$. Le formule si aggiornano con $V_{bi} \mapsto V_{bi} - V_{est}$, per esempio

$$x_{dep} = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_{bi} - V_{est})}$$

Ora $J_{diff} \uparrow$, cioè aumenta la diffusione dei portatori. Le concentrazioni dei minoritari all'equilibrio erano

$$p_{n0} = p_{p0} e^{-V_{bi}/V_T} = N_A e^{-V_{bi}/V_T} \quad (p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D})$$

$$n_{p0} = n_{n0} e^{-V_{bi}/V_T} = N_D e^{-V_{bi}/V_T} \quad (n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A})$$

mentre ora saranno

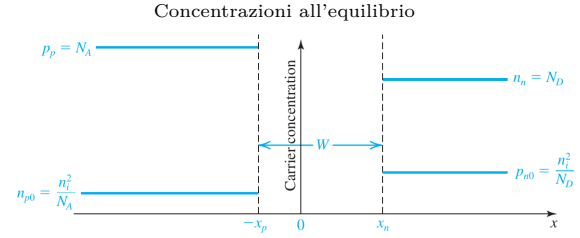
$$p_n(x_n) = N_A e^{-(V_{bi}-V_{est})/V_T} = p_{n0} e^{V_{est}/V_T} \iff p'_n(x_n) = p_{n0} (e^{V_{est}/V_T} - 1)$$

$$n_p(-x_p) = N_D e^{-(V_{bi}-V_{est})/V_T} = n_{p0} e^{V_{est}/V_T} \iff n'_p(-x_p) = n_{p0} (e^{V_{est}/V_T} - 1)$$

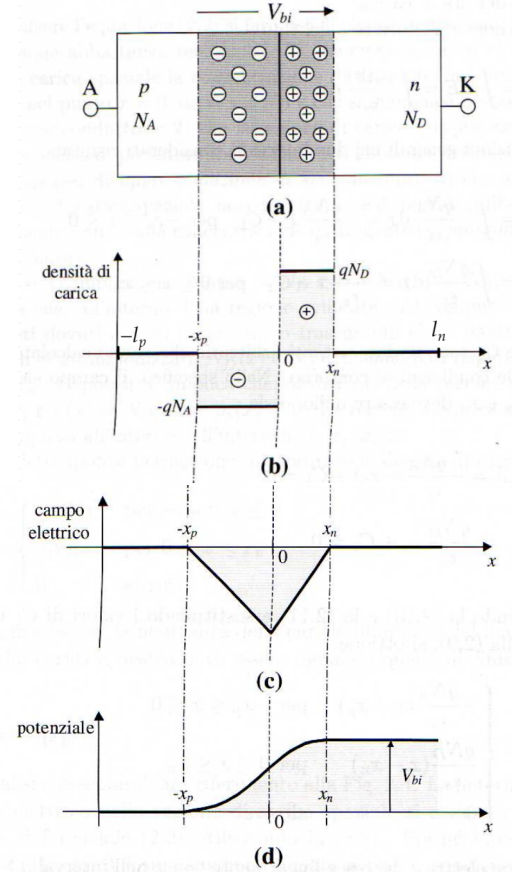
Nel caso saltassero fuori, con n' e p' si intendono le concentrazioni in eccesso: $n'_p = n_p - p_{p0}$, $p'_n = p_n - p_{n0}$. Vale che

$$p'(x_n) = p(x_n) - p_{n0} = p_{n0} (e^{V_{est}/V_T} - 1) \quad n'(-x_p) = n(-x_p) - n_{p0} = n_{p0} (e^{V_{est}/V_T} - 1)$$

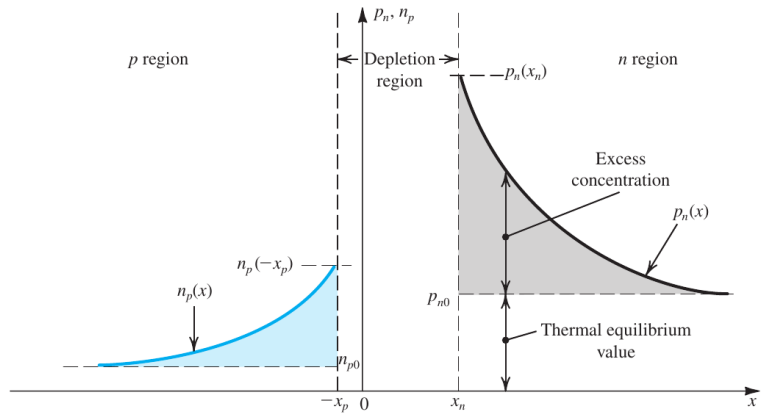
Per ricavare finalmente l'eqz per la corrente dobbiamo distinguere tra due casi: base lunga e base corta. Definiamo l'_n ed l'_p le estensioni delle zone neutre (ZN): $l'_n = l_n - x_n$, $l'_p = -(l_p - x_p)$.



Giunzione pn all'equilibrio



Esempio distribuzione dei minoritari nella polarizzazione diretta (basi lunghe)



5.2.1 Basi lunghe

Quando $l'_n \gg L_p$, $l'_p \gg L_n$. In questo caso i minoritari hanno spazio per decadere in modo esponenziale, e le loro concentrazioni sono date da

$$p_n(x) = p_{n0} + p_{n0}(e^{V_{est}/V_T} - 1)e^{-(x-x_n)/L_p} \quad \text{per } x > x_n \implies J_p(x) = q \frac{D_p}{L_p} \frac{n_i^2}{N_D} (e^{V_{est}/V_T} - 1)e^{-(x-x_n)/L_p}$$

$$n_p(x) = n_{p0} + n_{p0}(e^{V_{est}/V_T} - 1)e^{(x+x_p)/L_n} \quad \text{per } x < -x_p \implies J_n(x) = q \frac{D_n}{L_n} \frac{n_i^2}{N_A} (e^{V_{est}/V_T} - 1)e^{(x+x_p)/L_n}$$

La somma dei due contributi di corrente genera una corrente totale J_D costante in ogni punto, e pari a

$$J_D = J_p + J_n = q \left(\frac{D_p}{L_p} \frac{n_i^2}{N_D} + \frac{D_n}{L_n} \frac{n_i^2}{N_A} \right) (e^{V_{est}/V_T} - 1)$$

5.2.2 Basi corte

Quando $L_p > l'_n$, $L_n > l'_p$. In questo caso non c'è ricombinazione dei portatori iniettati (nelle zone neutre). Le concentrazioni e le correnti sono date da

$$n_p(l_p) = n_{p0} \quad n_p(x) = n_{p0} e^{V_{est}/V_T} \left(1 + \frac{x+x_p}{l'_p} \right)$$

$$p_n(l_n) = p_{n0} \quad p_n(x) = p_{n0} e^{V_{est}/V_T} \left(1 - \frac{x-x_n}{l'_n} \right)$$

$$\implies J_p(x) = J_p = q \frac{D_p}{l'_n} \frac{n_i^2}{N_D} (e^{V_{est}/V_T} - 1) = q \frac{D_p}{l'_n} p'_n(x_n)$$

$$J_n(x) = J_n = q \frac{D_n}{l'_p} \frac{n_i^2}{N_A} (e^{V_{est}/V_T} - 1) = q \frac{D_n}{l'_p} n'_p(-x_p)$$

quindi le correnti sono costanti, come anche la corrente totale di conseguenza

$$J_D = J_p + J_n = q \left(\frac{D_p}{l'_n} \frac{n_i^2}{N_D} + \frac{D_n}{l'_p} \frac{n_i^2}{N_A} \right) (e^{V_{est}/V_T} - 1)$$

Altra forma (con τ_{tr} i tempi di transito dei minoritari):

$$J_n = \frac{|Q_{Dn}|}{\tau_{tr,n}} \quad Q_{Dn} = \begin{cases} q \frac{n_i^2}{N_A} (e^{V_{est}/V_T} - 1) L_n & \text{se BL} \\ q \frac{n_i^2}{N_A} (e^{V_{est}/V_T} - 1) \frac{1}{2} l'_p & \text{se BC} \end{cases} \quad \tau_{tr,n} = \begin{cases} \tau_n & \text{se BL} \\ \frac{l_p'^2}{2D_n} & \text{se BC} \end{cases}$$

$$J_p = \frac{|Q_{Dp}|}{\tau_{tr,p}} \quad Q_{Dp} = \begin{cases} q \frac{n_i^2}{N_D} (e^{V_{est}/V_T} - 1) L_p & \text{se BL} \\ q \frac{n_i^2}{N_D} (e^{V_{est}/V_T} - 1) \frac{1}{2} l'_n & \text{se BC} \end{cases} \quad \tau_{tr,p} = \begin{cases} \tau_p & \text{se BL} \\ \frac{l_n'^2}{2D_p} & \text{se BC} \end{cases}$$

Comunque potremmo avere un mix, con basi diverse da un lato e dall'altro. In tal caso aggiorneremo in modo opportune le l^* . Quindi calcoliamo $L_{n,p}$ e confrontandole con $l'_{n,p}$ capiamo che l^* usare.

$$J_D = J_p + J_n = q \left(\frac{D_p}{l_p^*} \frac{n_i^2}{N_D} + \frac{D_n}{l_n^*} \frac{n_i^2}{N_A} \right) (e^{V_{est}/V_T} - 1) \quad l_p^* = \begin{cases} L_p & \text{basi lunghe} \\ l'_n & \text{basi corte} \end{cases} \quad l_n^* = \begin{cases} L_n & \text{basi lunghe} \\ l'_p & \text{basi corte} \end{cases}$$

5.3 Effetti capacitivi nella giunzione pn

Capacità di giunzione C_j e di diffusione C_{Dn} , C_{Dp} .

$$C_j = \frac{\varepsilon_{si}}{x_{dep}} A \quad C_{Dn} = \begin{cases} \frac{|Q_{Dn}|}{V_T} = \frac{J_n \tau_n}{V_T} & \text{se BL} \\ \frac{|Q_{Dn}|}{V_T} = \frac{J_n \tau_{tr,n}}{V_T} & \text{se BC} \end{cases} \quad C_{Dp} = \begin{cases} \frac{|Q_{Dp}|}{V_T} = \frac{J_p \tau_p}{V_T} & \text{se BL} \\ \frac{|Q_{Dp}|}{V_T} = \frac{J_p \tau_{tr,p}}{V_T} & \text{se BC} \end{cases} \quad C_{D,tot} = C_{Dp} + C_{Dn}$$

5.4 Revisione delle approssimazioni fatte

Svuotamento completo: è tanto più corretta quanto una variabile detta L_D , lunghezza di Debye, è piccola. Vale che $L_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_{si} V_T}{q N_{D||A}}}$. L'approssimazione delle ZN ci sta ma in realtà non sono del tutto neutre, c'è una tensione $\Delta V_{ZN} = V_T e^{(V_{est} - V_{bi})/V_T}$

5.5 Potenziali intrinseci

Potenziale intrinseco del Si^p e del Si^n :

$$\varphi_p = -V_T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) \quad \varphi_n = +V_T \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) \implies V_{bi} = \varphi_p - \varphi_n$$

6 Circuiti con diodi

Circuiti con condensatori. Equazione caratteristica: $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$, v_C è sempre continua, i_C non necessariamente. Per trovare v_C : supporre che abbia un andamento esponenziale; calcolare v_{C0} , $v_{C\infty}$ (si cerca v_C con C che è diventato un ca), $\tau = CR_{(eq \text{ vista dal } C)} = CR_{(eq \text{ Thv})}$

- Se tutto tranquillo \implies slz exp: $v_C(t) = v_{C\infty} + (v_{C0} - v_{C\infty})e^{-t/\tau}$
- Se $\nexists v_{C\infty}, \tau \implies$ slz lineare: $v_C(t) = \frac{A_{Nrt}}{C} t + v_{C0}$
- Se $\tau = 0 \implies$ slz degenerare: $v_C(t) = E_{Thv}$

6.1 Analisi di circuiti con diodi

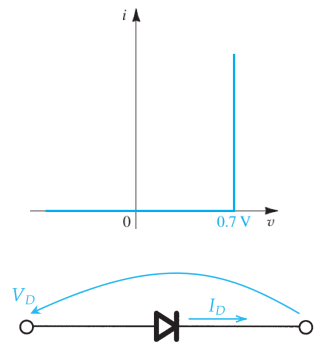
Se $V_D < V_\gamma \implies I_D = 0A \rightsquigarrow$ D OFF, diventa un ca.

Se $V_D = V_\gamma \implies I_D > 0A \rightsquigarrow$ D ON, diventa un GV che impone $V_\gamma = 0.7V$ e corrente $I_D > 0A$.

Non può accadere $V_D > V_\gamma$, perché il diodo quando è ON limita la tensione ai suoi capi.

Un solo diodo. Il metodo di soluzione quando si ha un solo diodo è studiare il bordo di conduzione BC: imponiamo $V_D = 0.7V$, $I_D = 0A$ e troviamo la tensione $V_{in}|_{BC}$ che garantisce ciò. Dopodiché cerchiamo di capire cosa accade per $V_{in} > V_{in}|_{BC}$ e $V_{in} < V_{in}|_{BC}$, guardando dove la corrente vuole scorrere (seguendo l'orientazione data da V_{in} e vedere se quel verso accoglie le preferenze del diodo; se ho più di un GV il verso della corrente dipende da quello più forte).

Più diodi. Il metodo ora è di capire a seconda della V_{in} quali diodi saranno sicuramente accesi e quali sicuramente spenti. In tal modo si arriva a trattare un singolo diodo acceso (avendo identificato gli altri spenti) e studiamo quindi il suo BC; e poi quello degli altri.



7 Semiconduttori

I semiconduttori sono materiali con proprietà intermedie tra quelle degli isolanti e dei conduttori. Hanno una struttura cristallina con periodicità tridimensionale.

- a $T \approx 0$ K si comportano come isolanti, non c'è energia per rompere i legami covalenti
- a $T > 0$ K si comportano come conduttori (migliori quando $T \uparrow$), perché grazie all'agitazione termica c'è sufficiente energia per rompere i legami.

Rompendo i legami si libera un elettrone, e^- di carica $-q$, che può vagare nel semiconduttore, e tale elettrone si lascia dietro una "carica" positiva detta lacuna, h^+ di carica $+q$. Insieme sono detti *portatori*. Quando si incontrano si *ricombinano*, riformando il legame covalente da cui erano nati. Mentre diremo che si *generano* (una coppia e^- , h^+) quando si rompe un legame covalente. Definiamo n , p le concentrazioni di elettroni e lacune; G e R i tassi di generazione e ricombinazione; n_i la concentrazione di elettroni e lacune nel silicio intrinseco. All'equilibrio vale sempre (cioè per silici intrinseci ed estrinseci) che:

$$np = n_i^2 \iff (\#e^-)(\#h^+) = \text{costante} \quad G = R$$

Fuori equilibrio riguardo ai due tassi vale invece che:

$$G - R = \left|_n - \frac{n'(x)}{\tau_n} = -\frac{n(x) - n_{p0}}{\tau_n} \quad G - R = \left|_p - \frac{p'(x)}{\tau_p} = -\frac{p(x) - p_{n0}}{\tau_p}\right.$$

La prima è detta legge di azione di massa. Parliamo di **silicio intrinseco** quando è puro, ha solo atomi di silicio, e lì vale che $n = p = n_i$. Parliamo di **silicio estrinseco** o drogato quando vengono aggiunte impurità (altri elementi) nel cristallo di silicio.

Silicio drogato n. Detta N_D la concentrazione degli atomi *donatori* (es. P), sono atomi che si ionizzano in (+) e che cedono un e^- .

Se $N_D \gg n_i$ allora

$$n_n = N_D \quad p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Silicio drogato p. Detta N_A la concentrazione degli atomi *accettori* (es. B), sono atomi che si ionizzano in (-) e che cedono un h^+ .

Se $N_A \gg n_i$ allora

$$p_p = N_A \quad n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

Notazione (esempio della): p_n concentrazione di p dal lato (silicio di tipo) n . Oltre alla legge di azione di massa può essere comodo negli esercizi metterla a sistema con la legge di neutralità della carica: $n + N_A = p + N_D$.

7.1 Flussi di corrente

Corrente di deriva (drift). Si ha quando c'è un campo elettrico E , per via del quale le lacune sono accelerate nella direzione concorde ad E , mentre gli elettroni nella direzione opposta. Definiamo

- J densità di corrente
- σ conducibilità
- ρ resistività
- μ mobilità
- D diffusività
- v_{th} velocità della particella dovuta all'agitazione termica
- τ_c tempo medio tra due urti
- l cammino medio tra due urti
- I corrente, superficie per densità

di corrente

- V_T tensione termica
- L lunghezza di diffusione

I portatori acquistano delle velocità, da cui si ricavano le densità di corrente

$$v_n^{\text{drift}} = -\mu_n E \quad v_p^{\text{drift}} = \mu_p E \quad \rightsquigarrow \quad J_n^{\text{drift}} = qn\mu_n E \quad J_p^{\text{drift}} = qp\mu_p E$$

$$\implies J_{\text{tot}}^{\text{drift}} = J_n^{\text{drift}} + J_p^{\text{drift}} = \sigma E = \frac{1}{\rho} E \quad \sigma = \frac{1}{\rho} = q(p\mu_p + n\mu_n) \approx \begin{cases} qp\mu_p & \text{se Si}^p \\ qn\mu_n & \text{se Si}^n \end{cases}$$

Corrente di diffusione (diff). Si ha quando c'è un gradiente di concentrazione di elettroni o lacune.

$$J_n^{\text{diff}} = qD_n \frac{dn(x)}{dx} \quad J_p^{\text{diff}} = -qD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

Deriva e diffusione insieme:

$$J_n^{\text{tot}} = J_n^{\text{drift}} + J_n^{\text{diff}} = qn\mu_n E + qD_n \frac{dn(x)}{dx} \quad J_p^{\text{tot}} = J_p^{\text{drift}} + J_p^{\text{diff}} = qp\mu_p E - qD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

Verso della corrente (in generale): concorde con lo spostamento delle lacune, che equivale a opposto allo spostamento degli elettroni.

7.2 Relazione di Einstein

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T = \frac{kT}{q}$$

Inoltre (collegata a V_T) c'è la relazione tra concentrazione e potenziale elettrico, valida solo all'equilibrio.

$$n(x) = n(0) \cdot e^{V(x)/V_T} = n(0) \cdot e^{-E_n^{\text{cin}}(x)/V_T} \quad p(x) = p(0) \cdot e^{-V(x)/V_T}$$

Se la giunzione è simmetrica ($N_A = N_D$) allora la tensione (V_{bi} e V_{est}) si equipartisce tra zona n e zona p . Per esempio in tal caso le concentrazioni alla giunzione sono date da:

$$n(0) = N_D e^{-(V_{bi} - V_{\text{est}})/(2V_T)} = N_A e^{-(V_{bi} - V_{\text{est}})/(2V_T)} = p(0)$$

